

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LİSANS TEZİ

İLETİM HATLARINDA EMPEDANS TABANLI ARIZA YERİ TESPİTİ

ÖYKÜ KESİM
HALİT BAYRAK

KOCAELİ 2015

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİTİRME PROJESİ

İLETİM HATLARINDA EMPEDANS TABANLI ARIZA YERİ TESPİTİ

ÖYKÜ KESİM
HALİT BAYRAK

Prof.Dr. Yusuf Bahar
Danışman, Kocaeli Üniv.

.....

Doç.Dr. Sevinç Ali Kara
Jüri Üyesi, Kocaeli Üniv.

.....

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Koç
Jüri Üyesi, Kocaeli Üniv.

.....

Tezin Savunulduğu Tarih: 01.06.2014

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Bu tez çalışması,.....amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Tez çalışmamda desteğini esirgemeyen, çalışmalarına yön veren, bana güvenen ve yüreklendiren danışmanım sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Tez çalışmamın tüm aşamalarında bilgi ve destekleriyle katkıda bulunan hocam..... teşekkür ediyorum.

Tez çalışmamda gösterdiği anlayış ve destek için sayın..... teşekkürlerimi sunarım.

Hayatım boyunca bana güç veren en büyük destekçilerim, her aşamada sıkıntılarımı ve mutluluklarımı paylaşan sevgili aileme teşekkürlerimi sunarım.

Mayıs – 2018

Ali EKEN

Bu dokümandaki tüm bilgiler, etik ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilip sunulmuştur. Ayrıca yine bu kurallar çerçevesinde kendime ait olmayan ve kendimin üretmediği ve başka kaynaklardan elde edilen bilgiler ve materyaller (text, resim, şekil, tablo vb.) gerekli şekilde referans edilmiş ve dokümanda belirtilmiştir .

Öğrenci No: 190202034

Adı Soyadı: ÖYKÜ KESİM

İmza:.....

Öğrenci No: 190201035

Adı Soyadı: HALİT BAYRAK

İmza:.....

İÇİNDEKİLER	
ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR	i
İÇİNDEKİLER	ii
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	iii
TABLOLAR DİZİNİ	iv
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	v
ÖZET.....	vii
ABSTRACT.....	viii
GİRİŞ	1
1. SAYISAL KORUMADA TEMEL KAVRAMLAR	3
1.1. Ayırık İşaretlerin Fazörel Gösterimi	3
1.2. Arıza Tipinin Belirlenmesi	6
2. İLETİM HATLARINDA EMPEDANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMALARI.....	12
2.1. Tek Bara Ölçümlerini Kullanan Arıza Yeri Bulma Algoritmaları	13
2.1.1. Basit reaktans algoritması	13
2.1.2. Takagi algoritması.....	13
2.1.3. Geliştirilmiş Takagi algoritması.....	14
2.2. İki Bara Ölçümlerini Kullanan Arıza Yeri Bulma Algoritmaları	14
2.1.1. Basit arıza gerilimi eşitliği algoritması	14
2.1.2. Asimetrik arıza yeri bulma algoritması.....	15
2.1.3. Negatif bileşenler ile arıza yeri bulma algoritması	16
2.1.4. Simetrik arıza yeri bulma algoritması	17
3. EMPEDANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMALARININ FARKLI TEST SİSTEMLERİNDE UYGULANMASI.....	20
3.1. Homojen Test Sistemi.....	20
3.2. Homojen Olmayan Test Sistemi	24
3.3. Homojen Olmayan Test Sistemi (Orta Uzun Hat Modeli - Pi Eşdeğer Devresi).....	28
4. SERİ KAPASİTÖRLÜ İLETİM HATLARINDA ARIZA YERİ TESPİTİ.....	33
5. SERİ KAPASİTÖRLÜ İLETİM HATLARI İÇİN PERFORMANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMASI	37
5.1. Algoritmanın Temel Arıza Yeri Bulma Algoritmaları İle Karşılaştırması	41
5.2. Seri Kapasitörlü İletim Hatlarını Baz Alan Arıza Yeri Bulma Algoritmalarının Karşılaştırılması	45
6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER	48
KAYNAKLAR	53
EKLER.....	59
KİŞİSEL YAYIN VE ESERLER	68
ÖZGEÇMİŞ	69

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1.1.	Yinelenen Fourier ifadesi	5
Şekil 1.2.	Simetrik bileşenlerin gösterimi a) pozitif bileşenler b) negatif bileşenler c) sıfır bileşenler	7
Şekil 1.3.	Şebekenin a) pozitif bileşen devresi b) negatif bileşen devresi c) sıfır bileşen devresi	8
Şekil 1.4.	Arıza öncesi, arıza anı ve arıza sonrası durum.....	9
Şekil 2.1.	İletim hattında arıza eşdeğer devresi	12
Şekil 3.1.	Homojen test sistemi	20
Şekil 3.2.	Homojen olmayan test sistemi	24
Şekil 3.3.	Homojen olmayan test sistemi(π modeli)	28
Şekil 5.1.	Seri kapasitörlü iletim hattı	37
Şekil 5.2.	Arıza yerinin S barası ve seri kapasitör arasında olma durumu	38
Şekil 5.3.	Performansa dayalı alınan algoritmanın akış diyagramı	41
Şekil 5.4.	Seri kapasitörlü test sistemi	42
Şekil 5.5.	MOV ve seri kapasitörde ki akım değişimi	43

TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo 1.1. Arıza tiplerine göre pozitif bileşen empedans eşitlikleri.....	10
Tablo 3.1. Homojen test sisteminde farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	21
Tablo 3.2. Homojen test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları.....	23
Tablo 3.3. Homojen olmayan test sisteminde farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları.....	25
Tablo 3.4. Homojen olmayan test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	26
Tablo 3.5. Homojen olmayan test sisteminde (orta uzun hat modeli - π eşdeğer devresi) farklı uzaklıklardaki farklı arıza tipleri için yüzde hata oranları.....	29
Tablo 3.6. Homojen olmayan π eşdeğer devreli test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	30
Tablo 4.1. Seri kompanzasyonun etkileri ve sonuçları.....	33
Tablo 4.2. Seri kompanze edilmiş iletim sistemleri için kullanılan bazı algoritmalar ve özellikleri	34
Tablo 5.1. Test sistemi parametreleri	42
Tablo 5.2. Test sisteminin simülasyon parametreleri	42
Tablo 5.3. Test sisteminin farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları.....	44
Tablo 5.4. Test sisteminin farklı arıza dirençlerindeki faz-faz-toprak arıza tipi için yüzde hata oranları	45
Tablo 5.5. Seri kapasitörü dikkate alan algoritmaların karşılaştırılması	46
Tablo 5.6. Seri kapasitörü dikkate alan algoritmaların genel özellikleri.....	47

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

$\alpha_{1,2,3}$: Eğim için alınan açı, (°)
φ	: Açık, (°)
θ	: Açık, (rad)
d	: Arıza noktasının referans baraya uzaklığı, (%)
d_{capS}	: Seri kapasitörün S barasına uzaklığı, (%)
d_{capR}	: Seri kapasitörün R barasına uzaklığı, (%)
d_S	: Arıza noktasının S barasına uzaklığı, (%)
d_R	: Arıza noktasının R barasına uzaklığı, (%)
f_0	: İşaretin frekansı, (Hz)
f_S	: Örnekleme frekansı, (Hz)
I^0	: Sıfır bileşen akımı, (A)
I^1	: Pozitif bileşen akımı, (A)
I^2	: Negatif bileşen akımı, (A)
I_a	: a fazı akımı, (A)
I_{ab}	: a fazı ve b fazı akımları farkı, (A)
I_b	: b fazı akımı, (A)
I_{bc}	: b fazı ve c fazı akımları farkı, (A)
I_c	: c fazı akımı, (A)
I_{ca}	: c fazı ve a fazı akımları farkı, (A)
I_{cap}	: Seri kapasitör üzerinden geçen akım, (A)
I_F	: Arıza noktasından geçen akım, (A)
I_{FR}	: Arıza noktasından geçen akımın R barasından gelen kısmı, (A)
I_{FS}	: Arıza noktasından geçen akımın S barasından gelen kısmı, (A)
$I_{önce}$: Arıza öncesi akım, (A)
I_R	: R barasından çıkan akımı, (A)
I_{ref}	: Alınan referans akım, (A)
I_S	: S barasından çıkan akımı, (A)
$I_{süp}$: Süperpozisyon akımı, (A)
$I_{süp}^*$: Süperpozisyon akımının eşleniği, (A)
R_F	: Arıza noktası empedansı, (Ω)
X_L	: Hat empedansının imajiner bileşeni, (Ω)
x_d''	: Senkron makinenin subtransientreaktansı, (pu)
V^0	: Sıfır bileşen gerilimi, (V)
V^1	: Pozitif bileşen gerilimi, (V)
V^2	: Negatif bileşen gerilimi, (V)
V_a	: a fazı gerilimi, (V)
V_{ab}	: a fazı ve b fazı gerilimleri farkı, (V)
V_b	: b fazı gerilimi, (V)
V_{bc}	: b fazı ve c fazı gerilimleri farkı, (V)
V_c	: c fazı gerilimi, (V)
V_{ca}	: c fazı ve a fazı gerilimleri farkı, (V)
V_{cap}	: Kapasitör öncesindeki bağlantı noktasının gerilimi, (V)
V_R	: R barası (uzak bara) gerilimi, (V)

V_{ref}	: Alınan referans gerilimi, (V)
V_S	: S barası (yakın/referans bara) gerilimi, (V)
V_F	: Arıza noktası gerilimi, (V)
Z_{Cap-F}	: Seri kapasitör ile arıza noktası arasındaki empedans, (Ω)
Z_L	: Hat empedansı, (Ω)
Z_R	: R barasından görülen thevenin empedansı, (Ω)
Z_S	: S barasından görülen thevenin empedansı, (Ω)

Kısaltmalar

AC	: AlternativeCurrent (Alternatif Akım)
ANN	: ArtificialNeural Networks (Yapay Sinir Ağları)
DDA	: DeterministicDifferentialApproach (Deterministik Diferansiyel Yaklaşım)
FACTS	: FlexibleAlternativeCurrentTransmissionSystem (Esnek Alternatif Akım İletim Sistemi)
IEEE	: TheInstitute of ElectricalandElectronicsEngineers (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)
Im	: İmajiner
min	: Minimum
MOV	: Metal OxideVaristor (Metal Oksit Varistör)
PMU	: PhasorMeasurementUnit (Fazör Ölçüm Ünitesi)
R	: Receiving (Alan)
Re	: Reel
S	: Sending (Gönderen)
SC	: Series Capacitor (Seri Kapasitör)

İLETİM HATLARINDA EMPEDANS TABANLI ARIZA YERİ TESPİTİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM

ÖZET

NYP'nin altında yatan birimselliğin ana fikri, her bilgisayar programının (izlence), etkileşim içerisinde olan birimler veya nesneler kümesinden oluştuğu varsayımdır. Bu nesnelerin her biri, kendi içerisinde veri işleyebilir, ve diğer nesneler ile çift yönlü veri alışverişinde bulunabilir. Hâlbuki NYP'den önce var olan tek yaklaşımda (Yordamsal programlama), programlar sadece bir komut dizisi veya birer işlev (fonksiyon) kümesi olarak görülmektedirler.

Anahtar kelimeler: Sesli haberleşme, arıza, Takagi, inheritance, mikro test, NYP, analog Hatları, DigSILENT, EMPEDANS, veri soyutlama, bilgi gizleme, yazılım bakımı.

NYP'nin altında yatan birimselliğin ana fikri, her bilgisayar programının (izlence), etkileşim içerisinde olan birimler veya nesneler kümesinden oluştuğu varsayımdır. Bu nesnelerin her biri, kendi içerisinde veri

işleyebilir, ve diğer nesneler ile çift yönlü veri alışverişinde bulunabilir. Hâlbuki NYP'den önce var olan tek yaklaşımda (Yordamsal programlama), programlar sadece bir komut dizisi veya birer işlev (fonksiyon) kümesi olarak görülmektedirler. Günümüzde sayısal ve analog elektronik, çok büyük ölçekli entegrasyonlar, ölçüm ve kontrol sistemleri, bilgisayarlar ve gömülü sistemler, yarı iletken malzemeler, mikroeletromekanik sistemler, nanoteknoloji, sinyal işleme, biyomedikal sistemler, mikrodalga ve antenler, telekomünikasyon sistemleri, fiber optik haberleşme, fotonik, elektrik makineleri, yenilenebilir enerji ve güç elektroniği konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır.